

ADVANTEST in our Lives



アドバンテストの「はかる」技術は、暮らしの「快適」と「安全・安心」を支えています



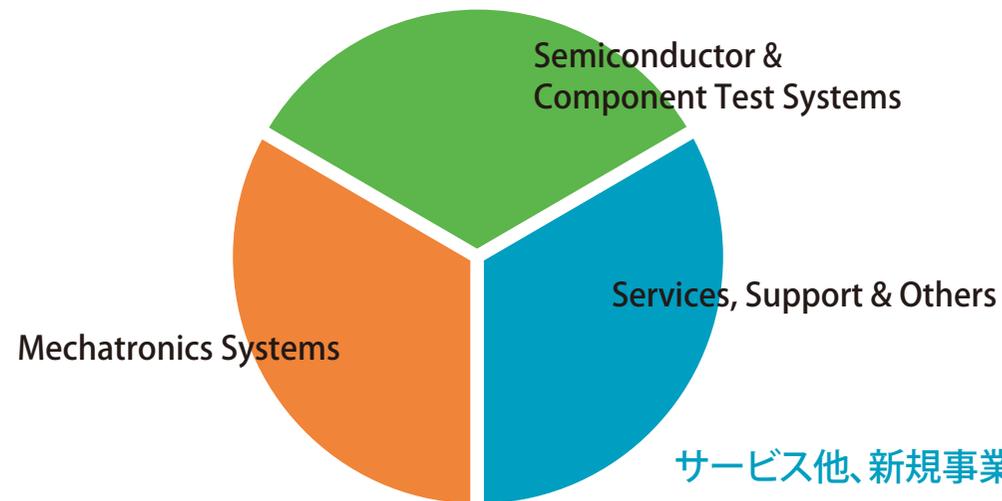
事業セグメント

先端技術を先端で支える

アドバンテストは創業以来、「計測」を事業の軸とし、暮らしの安全と安心を支えてきました。お客さまにご満足いただける技術・商品・サービスを提供するために、たえず自己研鑽に励み、最先端の技術開発を通じて社会の発展に貢献していきます。

半導体・部品テストシステム事業

スマートフォン、パソコン、自動車など身の回りのあらゆる機器に搭載されるさまざまな半導体の動作を試験するテスト・システムを提供します。



メカトロニクス関連事業

テスト工程の効率的な運用に欠かせないテスト・システム周辺機器や最先端デバイスの開発・製造に貢献するナノテクノロジー製品でお客様の半導体ビジネスを多方面からサポートします。

サービス他、新規事業

システム立ち上げやメンテナンス・サービスから、稼働率向上アプリケーションなどの高付加価値ソリューションまで、世界各地の拠点からお届けしています。また、これまで培ってきた技術を新しい分野にも展開し、画期的な製品による新たな市場の創出に挑戦しています。

半導体・部品テストシステム事業

■ 半導体テスト・システム

半導体に信号を入力し、出力信号を測定して良品/不良品判定を行います。アドバンテストの半導体テスト・システムは、高い生産性と、さまざまな品種のデバイスに対応したカバレッジの広さで、多くのお客様の支持をいただき、世界トップクラスの市場シェアを獲得しています。

SoCテスト・システム

マイクロ・プロセッサ、アプリケーション・プロセッサ、通信用IC、パワーマネジメントICなど、多種多様なSoC半導体の試験に柔軟に対応するため、ボード交換によってシステム構成を変更できるモジュール構造を採用しています。

また、スマートフォンのタッチパネルや、液晶テレビのディスプレイをコントロールするディスプレイ・ドライバIC向けテスト・システムは、世界各地に1,500台以上のインストール・ベースを有し業界標準機となっています。

メモリ・テスト・システム

DRAMやフラッシュ・メモリなどのメモリ半導体を高品質、高速かつ多数個同時にテストし、お客様の生産性向上に貢献します。



V93000



T2000



T6391



T5503HS



T5830

■ 計測システム EVA

プログラム言語不要の直観的な操作性や、優れた測定精度とシステム拡張性など、半導体テスト・システムと電子計測器双方のメリットを兼ね備えた計測システムです。アナログIC、センサ、ミクスドシグナルICなどさまざまな電子デバイスを、開発から量産まで一貫してサポートします。



EVA100

■ バーンイン・システム

半導体に熱的、電気的なストレスを加えて初期故障をスクリーニングし、不良品の流出を未然に防ぐためのシステムです。



B6700

メカトロニクス関連事業

■ テスト・ハンドラ

パッケージされた半導体をテスト・システムに高速搬送し、テスト結果に従って良品/不良品を自動分別します。被測定デバイスの搬送位置や温度を高速・高精度に制御し、コンタクト位置や温度管理にシビアな微細デバイスのハンドリングにも対応します。



M6245 [LINK](#)



M4871 [LINK](#)

■ デバイス・インタフェース

[LINK](#)

品種によって形状や仕様が異なる半導体を、テスト・システムに高精度で電氣的・機械的に接続する治具の総称です。多種多様なデバイスに対応できるエキスパート・チームが、世界各地の拠点から、お客様のデバイスの迅速な量産立ち上げをサポートします。



プローブ・カード [LINK](#)



チェンジ・キット [LINK](#)

■ MVM-SEM®

[LINK](#)

電子ビーム (Electron Beam) を用いて、半導体ウエハやフォトマスクに描かれた回路パターンの幅、高さ、側壁角度などをリアルタイムに3次元測定する、アドバンテスト独自の走査型電子顕微鏡です。半導体の微細化や3D構造化に対応し、着実に市場を拡大しています。



E3310 [LINK](#)



E3640 [LINK](#)

*MVM-SEM® = Multi Vision Metrology Scanning Electron Microscope(多次元観察・測長走査型電子顕微鏡)
※MVM-SEMは、(株)アドバンテストの日本、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■ EB露光装置

[LINK](#)

電子ビーム (Electron Beam) を用いて、1Xnmノードの先端半導体プロセスに求められる微細な回路パターンを、半導体ウエハなどに直接描画します。フォトリソグラフィーによる微細化の技術的難易度が高まりつつある中、EB露光はさらに先の微細化を可能にする技術として注目が集まっています。



F7000 [LINK](#)

テスト・セル

アドバンテストは、半導体の量産テストに欠かせない「テスト・システム」「テスト・ハンドラ」「デバイス・インタフェース」を組み合わせた「テスト・セル」を1社で供給することができます。テストに関する豊富な知見とノウハウを統合した「テスト・セル・ソリューション」は、業界最高レベルのテスト品質とテスト効率が評価され、多くのお客様に導入されています。

テスト・ハンドラ

デバイス・インタフェース

テスト・ヘッド

テスト・システム
メインフレーム



サービス他、新規事業

アドバンテストの新規事業

アドバンテストは、今後の一層の成長に向けて新たな事業の育成に取り組んでいます。培ってきた計測技術をシームレスに展開し、さまざまな社会課題の解決に貢献する革新的なソリューションの実現を目指しています。

■ テラヘルツ分光・イメージング解析システム [LINK](#)

超音波や赤外線などの従来技術では解析困難な物質を、テラヘルツ波を用いて非破壊解析します。医薬品の膜厚や錠剤密度の測定、電子回路の故障解析など、幅広い分野に新たな評価手法を提案します。

TAS7500シリーズ [LINK](#)



■ モバイル・システムレベル・テスト*

スマートフォンなどのモバイル機器が、地域や通信キャリアといったさまざまな環境下で正しく動作するかどうかを汎用的に検証するソフトウェアです。

* 米国子会社W2BI社より提供いたします

モバイル・システムレベル・テスト紹介ムービー
(クリックすると別ウィンドウが開きます)



■ 光超音波顕微鏡「Hadatomo™」

光と超音波を用いて、従来技術では困難だった皮膚表面下3mmの血管網の画像化を非侵襲、造影剤無しで実現。皮膚の研究や再生医療に新たな知見を提供します。

Hadatomo™ WEL5100 [LINK](#)



2010 テラヘルツ技術による非破壊解析システム販売開始

Cloud Testing Service株式会社発足 **2012**

■ CloudTesting™ Service*

半導体の測定・解析プログラムを、必要な分だけインターネットからユーザのパソコンにダウンロードし、月額ライセンスで利用可能。半導体設計評価や、大学などでの専門教育や研究のニーズに応えた、新たなビジネスモデルによるサービスです。

* 子会社Cloud Testing Service株式会社より提供いたします



CloudTesting™ Station [LINK](#)

(専用の測定端末。ユーザには無償でレンタルいたします)



2013 モバイル・システムレベル・テスト事業に参入

SSDテスト・システム販売開始 **2014** 「AirLogger™」販売開始

■ SSDテスト・システム [LINK](#)

ハイエンド・データサーバへの導入が拡大しているエンタープライズSSD(ソリッド・ステート・ドライブ)や、IoT時代を支えるクライアントSSDを、システムレベルでテストします。

MPT3000 [LINK](#)



2015 光超音波顕微鏡「Hadatomo™」発表

■ 無線温度ロガー「AirLogger™」

測定ユニットから温度、湿度、圧力などのデータを無線で通信することにより、測定前のケーブル接続作業を不要とし作業効率を大幅にアップ。密閉空間や回転体も容易に測定できます。



AirLogger™ 温度測定ユニット [LINK](#)

